SURFACE-EMISSION TYPE SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF	
Patent Number:	JP4029374
Publication date:	1992-01-31
Inventor(s):	SEKII HIROSHI; others: 01
Applicant(s):	OMRON CORP
Requested Patent:	
Application Number:	JP19900132694 19900524
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L33/00
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PURPOSE:To obtain a large-output light-emitting element which is superb in cooling property by allowing a crystal layer including a light-emitting region to be grown on a substrate for growth and then an Si substrate to be joined to an uppermost layer of the crystal layer as a new substrate and further the substrate for growth to be eliminated. CONSTITUTION:An n-Ga0.3Al0.7As clad layer 2, a Ga0.6Al0.4As activation layer 3, and a p-Ga0.3Al0.7As clad layer 4 are allowed to grow on a GaAs layer 1 in sequence, an ohmic electrode is formed on the p-Ga0.3Al0.7As clad layer 4, and Au is exposed on its uppermost layer. Then, a p-Si substrate 5 is placed on this ohmic electrode, is heated, and then the Si substrate 5 and the p-Ga0.3 Al0.7As clad layer 4 are bonded. Finally, the GaAs substrate 1 is eliminated by etching etc., thus enabling cooling property to be improved.	
Data supplied from the esp@cenet database - 2	

18日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-29374

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)1月31日

H 01 L 33/00

A 8934-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

の発明の名称

面出射型半導体発光素子およびその作製方法

②特 顧 平2−132694

❷出 願 平2(1990)5月24日

@発明者 関 井

宏 京都府

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン株式会社

内

@発明者 今 仲 行 -

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン株式会社

内

勿出 題 人 オムロン株式会社

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

10代 理 人 弁理士 牛久 健司

明知會

1. 発明の名称

面出射型半導体発光素子 . およびその作製方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 成長用基板上に発光領域を含む結晶圏を成長させ,

その後、結晶層の最上層に新たな基板として S!基板を接合しかつ成長用基板を除去する。

面出射型半導体発光素子の作製方法。

- (2) 結晶層の最上層に Au 膜を形成し、この Au 膜に S I 基板を接した状態で加湿することにより Au と S i の合金反応を利用して S i 基板を接合する、 請求項(I) に記載の面出射型半導体発光素子の作製方法。
- (3) 成長用基板上に結晶成長した発光領域を含みかつ成長用基板が除去された結晶成長層が新たなSI 基板に接合されてなる面出射型半導体発光素子。

(4) 結晶成長層と S! 基板との接合面が S! と Au との合金で形成されている鯖求項(3) に記載の面出射型半導体発光素子。

3. 発明の詳細な説明

発明の要約

結晶成長後、成長用基板をエッチング等により除去し、新たな基板としてS」を用いることで放無特性に優れた高出力発光素子が得られる。作製が容易でかつ均一性の優れたものであり、後加工も容易であるから、LEDアレーや面発光レーザ等への応用、展開も可能である。

技術分野

この発明は面出射型半導体発光素子およびその 作製方法に関する。

従来技術とその問題点

面出射型半導体発光素子では発光した多くの光 が成長用基板で吸収されてしまうので、その光出 力を向上させるために、成長用基板上に発光層を 含む複数層の結晶層を結晶成長させたのち、成長 用基板をエッチング等で取り去る方法が一般的に とられている。

この方法の問題点としては以下の点が挙げられる。

結晶成長層の一部を基板として使用することに なるため結晶成長層が全体として200 μm以上必 髪となり、成長時間が異常に長くなる。

成長 腹厚の 制御性が悪いため 光出力の均一性が悪く、場合によっては必要な 後加工も困難である。

結晶成長層の熱伝導が除去される成長用基板の それよりも悪いために高出力動作時発熱しやすい。

上記の従来の方法およびその問題点を、第4図 および第5図を参照して具体的に説明する。高出 力発光ダイオード(LED)を例に挙げる。

LEDを高出力化する方法には大きく分けて次の2つがある。

- ダブルヘテロ (DH) 構造にすることで内 部発光効率を向上させる。
- 2. 光の取出し効率を向上させる。

Ga_{0.5}A 2_{0.5}As 層 15を新たな暑板として使用 し、素子を上下反転した状態で、この基板15の下 面に電極17を、クラッド層 12の上面の一部に電極 18をそれぞれ形成する。

Ga-Al-As 系材料の場合、Al の含有量の高い組成ほどエネルギ・ギャップが広くなるため、 $Ga_{0.8}Al_{0.4}As$ 活性層 18に対してAl 組成比の高い $p-Ga_{0.5}Al_{0.5}As$ 暦 15をここでは芸板の代わりとしている訳である。このようにして、 $Ga_{0.8}Al_{0.4}As$ 活性層 18から等方的に発光した光に対して基板 15側に向う光は電板 17で反射され、基板 15内で往後して上面に出射する。これにより、上記2.の光の取出し効率の向上が達成される。

しかしながら、基板として使うには結晶成長層は200 μm以上の厚さが必要であり、結晶成長時間が異常に長くかかる。

また、結晶成長層が厚くなると名層の膜厚もば らつくため、光出力の面内はらつきが大きくなっ たり、発光領域を限定するような後加工も難しく 特に 2. の光の取出し効率を向上させる手法として結晶成長用 芸板を除去してこの基板による光の 吸収をなくし、反射させることにより外部に出射 させている。

第 4 図 (A) , (B) は Ga-Ad-As 系半導体材料 を用いて L E D を製造するプロセスを示している。

GaAs 基板 11上にn-Ga_{0.3} A 2_{0.7} As クラッド 暦12. Ga_{0.6} A 2_{0.4} As 活性暦13, p-Ga_{0.8} A 2_{0.7} As クラッド暦14およびp-Ga_{0.5} A 2_{0.5} As 暦15 を順次成長させる(第4図(A))。

この構造はDF構造であるから内部発光効率は高い。しかし、基板11として用いたGaAsがGa_{Q.6}A Q_{Q.4}As 活性層18で発生した光の吸収体として働くため、GaAs 基板11が存在すると等方的に発光する光のうち半分近くは吸収され外に出射しないために光出力が向上しない。そこでGaAs 基板11のみをエッチング等で除去する(第4 図(B))。

そして、第5回に示すように、最上層のp-

なる。

さらに、 Ga-Al-As 系の材料の場合、 Al 含有量が増える Imと熱伝導率が悪くなるため、 拡板材料を Ga As から Ga O.5 Al D.5 As に変更することで放熱特性が悪くなり、 素子自体が発熱しやすくなる、等の問題点がある。

発明の目的

この発明は、成長用基板を除去しても結晶成長 層を新たな基板として使用する必要のない面出射 型半導体発光素子およびその作製方法を提供する ことを目的とする。

発明の構成、作用および効果

この発明による面出射型半導体発光素子の作製方法は、成長用基板上に発光領域を含む結晶層を成長させ、その後、結晶層の最上層に新たな基板としてSi基板を接合しかつ成長用基板を除去することを特徴とする。

 Si苺板を接合する。

この発明による面出射型半導体発光素子は、成長用基板上に結晶成長した発光領域を含みかつ成長用基板が除去された結晶成長層が新たなS!基板に接合されてなることを特徴とする。

好ましくは、結晶成長層とS! 基板との接合面。 がS!とAuとの合金で形成されている。

この発明によると、結晶成長層にSI 基板が接合されているから結晶成長層を基板として用いる必要はなく、結晶成長層はせいぜい数10μmで済むので成長時間が短くて済む。

また、成長腰厚がそれほど厚くなく通常レベルなので制御性がよく。 光出力の均一性がよい。 さらに後加工が必要であっても容易である。

さらにSI 基板を用いているため熱伝導性が向上し発熱の影響が少なくなる。

S 1 基板の接合のためにAu を用いると、Au と S 1 の共晶部分が光の反射層として働くため光 の取出し効率が優れたものとなる。

実施例の説明

との接合面はAu とSI の合金化領域 6 となる。 最後に Ga As 基板 1 をエッチング等により除去する(第1図(C))。

をして、第2図に示すように、この素子を上下 反転し、S! 基板5の下面に電極7を、クラッド 暦2上面の一部に電極8を設ける。

この実施例においては、成長層(クラッド層 2、4および活性層3)がトータルでせいぜい数 10μmで済むので成長時間が短くて済む。

また、成長腹厚が通常レベルなので腹厚制御性がよく光出力の均一性がよく、後加工が必要であったとしても容易である。

CaAs および Si の 熱伝導率はそれぞれ 0.13 および 0.86 cal/cm·sec·degであるから SI 基板を用いることにより 従来より放熱特性が向上する。

さらに、AuSi合金化領域は活性層3で発光する光に対して反射体として働くから(第2図参照)光の取出し効率の点でも優れている。

この発明による面出射型半 体発光素子は GaAs系の材料に限定されないのはいうまでもな 第1図はこの発明による面出射型半導体発光素子の作製方法の一例を示しており、 第2図は作製された面出射型半導体発光素子の 構造および動作状態を示している。

GaAs 基板 1 上に n-Ga_{0.8} A l_{0.7} As クラッド層 2 、 Ga_{0.6} A l_{0.4} As 活性層 3 および p - Ga_{0.8} A l_{0.7} As クラッド層 4 を 順次成長させる (第 1 図 (A))。この構造は D H 構造であるから 内部発光効率が高い。

p-Ga_{0.8}A Q_{0.7} As クラッド磨 4 上にオーミック電極を形成し、その最上階には A u が銘出するようにしておく。

そして、このオーミック電極上 に p - S ! 基板 5 を置き、加熱することにより、 S ! 基板 5 と p - Ga_{0.8} A Q_{0.7} As クラッド圏 4 とを接着させる (第 1 図(B))。 S ! と A u は 第 2 図に示すような状態図に従って合金化するから A u と S i を 直接接触させながら熱処理する ことにより p - Ga_{0.8} A Q_{0.7} As クラッド圏 4 と S ! 基板 5 を接着することができる。クラッド圏 4 と S ! 基板 5

い。また、面出射型発光案子であればレーザ・ダイオード(LD)でもLEDでもよく、アレー化してもよい。上記実施例ではSI 芸板と接着する脳がクラッド脳となっているが、 光を透過する脳であればクラッド圏とSI 芸板と の間に介在させてもよい。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)から(C)はこの発明による面出射型 半導体発光素子の作製方法を示すものである。

第2図は作製された面出射型半導体発光素子の 構成を示す断面図である。

第3図はSIとAuとの状態図を示すグラフである。

第4図(A) および(B) は従来の 面出射型半導体発光素子の作製方法を示すものであり、第5図は従来の面出射型半導体発光素子を 示す断面図である。

1 ··· GaAs 基板。

2 ··· n - Gan RA Pa T AB クラッド層,

3 ··· Ga_{0.8} A P_{0.4} As 活性層,

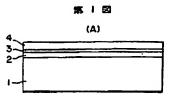
4 … p-Ga_{0.8}A L_{0.7} As クラッド層,

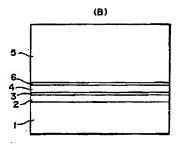
5 ··· p - S 1 恭板。

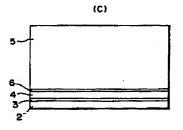
6 ··· AuSI合金化領域。

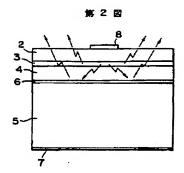
以上

特許出願人 オムロン株式会社 代理人 弁理士 牛 久 健 司

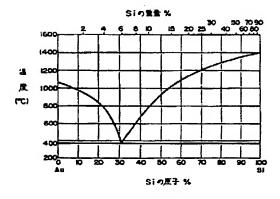








意 3 章



-454-

